· VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REO'D 17 JAN 2005

WIPO POT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts M 4772-ro/al				WEITERES VORGEHEN siehe Mittellung über die Übersendung des Internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)					
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/11126				Internationales Anmeld 08.10.2003	edatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 09.10.2002			
	nationa N21/C		entklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation u	nd IPK				
Anm MIC		IOLY	/TICS GMBH et al.						
1.	Dies beau	er inte	ernationale vorläufige Pi en Behörde erstellt und	üfungsbericht wurde v wird dem Anmelder ge	on der mit der internatio emäß Artikel 36 übermit	onalen vorläufigen Prüfung Itelt.			
2.	Dies	Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.							
	 Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ans und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vom Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlin PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter. 				e liegen, und/oder Blätter mit vor dieser				
3.	Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:								
	1	\boxtimes	Grundlage des Besch	eids					
	II		Priorität						
	III		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neu	heit, erfinderische Tätig	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
ĺ	IV		Mangelnde Einheitlich	keit der Erfindung					
	٧	Ø				eit, der erfinderischen Tätigkelt und der zung dieser Feststellung			
	VI		Bestimmte angeführte	Unterlagen					
	VII		Bestimmte Mängel de	r internationalen Anme	ldung				
	, VIII		Bestimmte Bemerkun	gen zur internationaler	Anmeldung				
Datu	Datum der Einrelchung des Antrags				Datum der Fertigstellur	ng dieses Berichts			
23.	23.04.2004				14.01.2005				
Nam bear	ne und uftragte	n Beh		ionalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedie	ensteter			
Europäisches Patentamt D-80298 München					Consalvo, D	in a supplier			
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			656 epmu d	Tel. +49 89 2399-7093	The Office omportunity				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PC

PCT/EP 03/11126

1.	Grur	idlage	des	Berichts
----	------	--------	-----	-----------------

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Be	schreibung, Seiten										
	1-1	6	in der ursprünglich eingereichten Fassung									
	An	Ansprüche, Nr.										
	1-7		eingegangen am 28.12.2004 mit Schreiben vom 27.12.2004									
	Zei	chnungen, Blätter										
	1/2	-2/2	in der ursprünglich eingereichten Fassung									
2. Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Bedie internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden i unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		internationale Anmei	e: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der dung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern ts anderes angegeben ist.									
	Die ein	Bestandteile stander gereicht; dabei hande	n der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache it es sich um:									
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b)	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist).									
		die Veröffentlichung	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).									
		die Sprache der Übe worden ist (nach Re	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).									
3.	Hin: inte	Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist di Internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:										
		in der internationale	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.									
		zusammen mit der i	nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.									
		bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.										
		bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.										
		Die Erklärung, daß o Offenbarungsgehalt	las nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.									
		Die Erklärung, daß o Sequenzprotokoll en	lie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen tsprechen, wurde vorgelegt.									
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:									
		Beschreibung,	Seiten:									
		Ansprüche,	Nr.:									
		Zeichnungen,	Blatt:									

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT

PCT/EP 03/11126

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-7

Entire de alte alte a Tanto to de de de

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche 1-7

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1 Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-7

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt I Grundlage des Bescheides

1. Geänderte Anspruchsfassung

Die mit Schreiben vom 27.12.2004 eingereichten Änderungen erfüllen die Erfordernisse des Artikels 34(2)(b) PCT. Der neue Anspruch 1 entspricht dem Anspruch 1, wie mit dem Schreiben vom 15.04.2004 eingereicht, in welchen die Merkmale des Anspruchs 7 aufgenommen wurden.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. ZITIERTE DOKUMENTE

In diesem Bericht werden folgende Dokumente genannt:

- D1: DE 101 04 957 A (GESIM GES FUER SILIZIUM MIKROS) 21. März 2002 (2002-03-21)
- D2: DE 41 37 060 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 13. Mai 1993 (1993-05-13)
- D3: DE 197 39 126 C (KARLSRUHE FORSCHZENT) 29. April 1999 (1999-04-29).

2. NEUHEIT UND ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT (Art. 33(2), 33(3) PCT)

Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 die Neuheit im Sinne von Artikel 33(2) und erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beinhaltet.

2.1 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1

Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart in Ansprüchen 1-16 und Abbildungen 4,5 ein Verfahren zur Herstellung einer Durchflussmesszelle, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- (a) Bereitstellen eines ersten (2) und eines zweiten (1) Fensters, wobei das zweite Fenster (1) zumindest zwei Probendurchflusskanäle (4) zum Zu-bzw. Abführen der zu vermessenden Probe aufweist;
- (b) Aufbringen einer strukturierten Dünnschicht (5) auf eines der Fenster (1);
- (c) Inkontaktbringen und flüssigkeitsdichtes Fixieren der Dünnschicht (5) an dem anderen der Fenster (2) derart, dass einander zugewandte, planparallel verlaufende Fensterflächen der Fenster (1,2) und die Dünnschicht (5) einen Durchflussraum (3) begrenzen, welcher lediglich durch die Probendurchflusskanäle (4) zugänglich ist, wobei die Fenster (1,2) zumindest im Bereich des Durchflussraums (3) zumindest bereichsweise optisch transparent sind; und
- (d) zumindest bereichsweises Ausgiessen eines Ausgussraums (14) zwischen den Fenstern (1,2) welcher von dem Durchflussraum (3) durch die Dünnschicht (5) getrennt ist und an die strukturierte Dünnschicht (5) angrenzt, mit Klebstoff, wobei das flüssigkeitsdichte Fixieren der Dünnschicht (5) an dem anderen der Fenster (1,2) ein Erweichen der Dünnschicht zur temporären Erniedrigung von deren Viskosität durch Temperaturerhöhung der Dünnschicht und/oder Anpressdruckerhöhung der Dünnschicht an das andere Fenster umfasst (siehe D1. Spalte 3, Zeilen 24 30).

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich von der aus D1 bekannten Verfahren dadurch, daß:

e) die Dünnschicht nach Schritt (d) entfernt wird.

Anspruch 1 erfüllt daher das Erfordernis der Neuheit gemäss Artikel 33(2) PCT.

Der technische Effekt des Merkmals e) ist, daß die Dünnschicht die Geometrie des Durchflussraums definiert, ohne aber diesen zu begrenzen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Entwickung eines Verfahren,

dessen Einsatz die Herstellung von Dünnschichtszellen mit höherer Präzision und Reproduzierbarkeit der Schicktdickte erlaubt, wobei durch die geometrische Gestalt der Dünnschicht auch der Aufbau von komplexen Geometrien des Ausgussraums, bzw. Probendurchflusskanäle unproblematisch wird.

Gemäss der Erfindung gelingt, mit der Verfahrenschritten (a) bis (e) eine Miniaturisierung der Dünnschicktzelle.

Keines der im Recherchenbericht zitierten Dokumente offenbart oder gibt einen Hinweis darauf, eine Dünnschicktzelle auf diese Weise herzustellen.

In D2 ist eine Küvette für die Infrarotspektroskopie offenbart wobei die geringe Spaltbreite dadurch erreicht wird, dass der die Spaltbreite bestimmende Abstandshalter zwischen den Fenstem eine Siliziumdioxidschicht ist, die bsw. durch Epitaxie auf eine der Siliziumscheiben aufgebracht wird. Die Spaltbreite kann somit in einen weitem Bereich variiert werden. Die Siliziumdioxidschicht ist fest mit der zweiten Siliziumscheibe verbunden. Als Zulauf- und Abflussöffnung für die zu untersuchende Substanz dienen zwei durchgängige Öffnungen in der Siliziumscheibe, die so angeordnet sind, dass sie nach dem Zusammenfügen mit der Siliziumdioxidschicht in die Aussparrung dieser Schicht einmünden. Nach dem Füllen des Probenvolumens mit der zu untersuchenden Substanz werden die Öffnungen verschlossen.

D3 beschäftigt sich mit der Vermeidung von Interferenzmustern und zeigt in Abbildung 1 den Aufbau der Dünnschichtzelle, bei der die optische Weglänge zwischen 3 und 200 µm liegt. Sie setzt sich aus Deckplatte mit Grabenstruktur 1 und der Grundplatte 2 zusammen. Die optische Weglänge wird dabei durch die Tiefe des Grabens in der Deckplatte 1 bestimmt. Abbildung 2 offenbart eine Deckplatte mit zusätzlicher Strukturierung zur Vermeidung von Interferenzmustern.

Daher wird das Verfahren von Anspruch 1 als erfinderisch betrachtet.

14

Amtl. Aktenzeichen: PCT/EP03/11126
Anmelder: micro-biolytics GmbH

"Dünnschichtzelle"

Unser Zeichen:

M 4772 - ro / al

Ansprüche

- Verfahren zur Herstellung einer Durchflußmeßzelle zur spektroskopischen Vermessung hindurchzuleitender Proben, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:
 - (a) Bereitstellen eines ersten (10) und eines zweiten (22) Fensters, wobei das zweite Fenster (22) zumindest zwei Probendurchflußkanäle (24) zum Zubzw. Abführen der zu vermessenden Probe aufweist;
 - (b) Aufbringen einer strukturierten Dünnschicht (18) auf eines der Fenster (10, 22);
 - (c) Inkontaktbringen und flüssigkeitsdichtes Fixieren der Dünnschicht (18) an dem anderen (22, 10) der Fenster derart, daß einander zugewandte, planparallel verlaufende Fensterflächen (14, 20) der Fenster (10, 22) und die Dünnschicht (18) einen Durchflußraum (26) begrenzen, welcher lediglich durch die Probendurchflußkanäle (24) zugänglich ist, wobei die Fenster (10, 22) zumindest im Bereich des Durchflußraums (26) zumindest bereichsweise optisch transparent sind; und
 - (d) zumindest bereichsweises Ausgießen eines Ausgußraums (26) zwischen den Fenstern (10, 22), welcher von dem Durchflußraum (26) durch die Dünnschicht (18) getrennt ist und an die strukturierte Dünnschicht (18) angrenzt, mit Klebstoff, wobei

das flüssigkeitsdichte Fixieren der Dünnschicht (18) an dem anderen (22, 10) der Fenster ein Erweichen der Dünnschicht (18) zur temporären Erniedrigung von dezur ern Viskosität durch Temperaturerhöhung der Dünnschicht (18) und/oder Anpreßdruckerhöhung der Dünnschicht (18) an das andere (22, 10) Fenster umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß

die Dünnschicht (18) nach Schritt (d) entfernt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Dünnschicht (18) aus einem viskosen Material mit einer Viskosität von mindestens 10.000 mPas bei einer Temperatur von 20 °C besteht und das flüssigkeitsdichte Fixieren der Dünnschicht (18) an dem anderen (22, 10) der Fenster den Schritt eines Andrückens der viskosen Dünnschicht (18) an das andere Fenster (22, 10) umfaßt.

<u>2</u>4

- 3. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei eine strukturierte Abstandshalterschicht (16) mit vorbestimmter Schichtdicke auf eine der Fensterflächen (14, 20) von zumindest einem der Fenster (10, 22) aufgebracht wird und die Abstandshalterschicht (16) mit der Fensterfläche (20, 14) des anderen Fensters (22, 10) im Schritt (c) in Kontkakt tritt, so daß der Abstand zwischen den Fensterflächen (14, 20) durch die Schichtdicke der Abstandshalterschicht (16) festgelegt wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Abstandshalterschicht (16) in einem Randbereich des Fensters (10, 22) aufgebracht wird.
- 5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Dünnschicht (18) eine geschlossene ringförmige Gestalt aufweist.
- 6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei zumindest eines der Fenster (10, 22) zumindest einen Klebstoffkanal (12) zum Zuführen des Klebstoffs in den Ausgußraum (28) aufweist.
- 7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Abstand der Fensterflächen (14, 20) nach Schritt (d) im Bereich von 0,5 bis 100 μm, bevorzugt 1 bis 50 μm und am meisten bevorzugt 3 bis 15 μm liegt.